Лабораторная работа 11.1 Определение ширины запрещенной зоны полупроводника

Гарина Ольга Б04-901

17 марта 2022 г.

Содержание

1	Введение	3
2	Исследование зависимости $\sigma(T)$ с помощью универсального цифрового вольтметра В7-34А	5
3	Результаты	6
4	Вывод	7
5	Литература	9

Цель работы: исследовать температурную зависимость проводимости типичного полупроводника - германия или кремния, определить ширину запрешенной зоны.

1 Введение

С точки зрения электрических свойств все твердые тела разделяются на металлы, полупроводники и изоляторы. Из-за расщепления энергии по уровням твердые тела имеют зонную структуру. Число электронов, которое может поместиться в зоне, не зависит от взаимодействия и точно неизвестно: оно равно числу атомов в кристалле, умноженному на степень вырождения уровня, из которого образовалась зона. Если зона полностью занята, ее электроны не могут участвовать в электропроводности, ибо при этом энергия электронов под дейтвием поля должна увеличиваться, а все энергетические уровни заняты. Заполненные зоны называются валентными зонами. Частично заполненные зоны называются зонами проводимости.

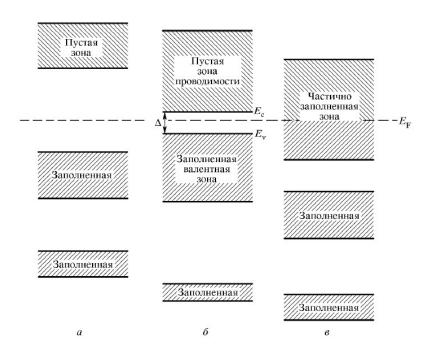


Рисунок 1 — Схематическая диаграмма энергетических зон для изолятора (a), полупроводника (б) и металла (в), указывающая фундаментальное различие между ними (при T=0)

Отсюда сразу становится понятным, в чем отличие проводников от полупроводников – это вопрос заполнения зон электронами, и, естественно, структуры зон. У проводников электроны частично заполняют верхнюю разрешенную зону (зону проводимости), в полупроводниках и изоляторах при T=0 в зоне проводимости нет электронов.

Если ширина запрещенной зоны между валентной зоной и зоной проводимости велика по сравнению с характерной тепловой энергией, то такие вещества являются изляторами, если она достаточно мала, мы имеет дело с полупроводниками, и так как вероятность появления электронов в зоне проводимости из валентной зоны за счет тепловой энергии пропорциональна больцмановскому фактору $exp(-\Delta/kT)$, где Δ — ширина запрещенной зоны, то проводимость полупроводников, зависящая от числа носителей в зоне проводимости, будет иметь сильную температурную зависимость.

Полупроводниками принято называть вещества с полностью заполненной валентной зоной, отсутствием электронов в зоне проводимости при T=0 и величиной щели Δ меньше или порядка 3 эВ.

Переход электрона из валентной зоны в зону проводимости сопровождается появлением "свободного места" в электронном спектре. Электрон, оказавшийся на одном из разрешенных уровней зоны проводимости, может свободно перемещаться под действием электрического поля, т.е. создавать ток. В то же время, на вакантный уровень в валентной зоне может переместиться один из электронов этой зоны. В результате образуется новое свободное состояние ("дырка") и т.д.

Вероятность заполнения уровней определяется функцией Ферми, которая в нашем случае мало отличается от простого экспоненциального больцмановского распределения:

$$f(E) = \frac{1}{exp(\frac{E-\mu}{kT})} \approx exp\left(-\frac{E-\mu}{kT}\right). \tag{1}$$

В собственных полупроводниках энергия Ферми лежит вблизи середины запрещенной зоны. При не очень высоких температурах заняты главным образом уровни, находящиеся у дна зоны проводимости, так что в качестве энергии E можно подставить энергию E_c , соответствующую дну зоны проводимости.



Рисунок 2 — Схема энергетических зон, поясняющая явление собственной проводимости (a) и указывабщая расположение донорных и акцепторных уровней (б)

В присутствии поля большая часть электронов в зоне проводимости начинает двигаться в сторону, противоположную полю. Средняя величина скорости электронов перестает быть равной нулю и направлена вдоль поля. При этом вплоть до самых сильных полей справедлива формула

$$v_{\rm cp} = \mu_n \varepsilon, \tag{2}$$

где $v_{\rm cp}$ – среднее значение дрейфовой скорости электронов, ε – напряженность электрического поля, μ_n – коэффициент пропорциональности, носящий название подвижности электронов.

$$\sigma = j/\varepsilon = |e|(n_n\mu_n + n_p\mu_p). \tag{3}$$

Подставляя $n_p = n_n$:

$$\sigma = |e|C(\mu_n + \mu_p)exp(-\frac{\Delta}{2kT}) = Aexp(-\frac{\Delta}{2kT}). \tag{4}$$

Измерим электропроводность как функцию температуры и изобразим результаты на графике в полулогарифмическом масштабе

$$ln\sigma = f(1/T). (5)$$

Эта формула показывает, что график должен иметь вид прямой линии с наклоном $\Delta/2kT$.

2 Исследование зависимости $\sigma(T)$ с помощью универсального цифрового вольтметра B7-34A

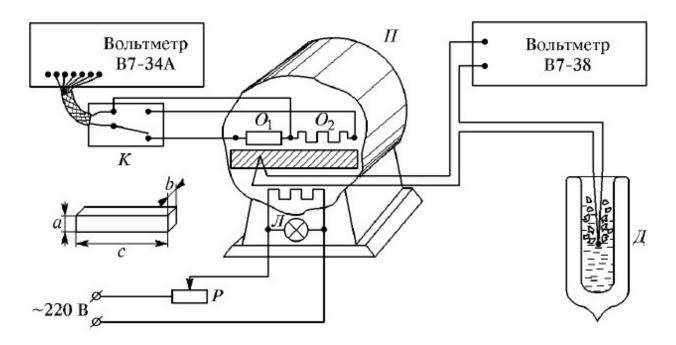


Рисунок 3 — Схема установки по измерению зависимости $\sigma(T)$ с помощью вольтметра B7-34A

В данной лабораторной работе измерялась зависимось сопротивления от температуры с помощью установки, приведенной на рисунке 3.

Нагрев образцов в электропечи регулируется реостатом Р. О мощности, подводимой для нагрева, можно судить по яркости свечения лампы Л. Температура образцов измеряется медь-константановой термопарой. Один спай термопары

находится непосредственно у образцов, другой – в сосуде Дьюара Д с тающий льдом. ЭДС термопары измеряется вольтметром В7-38. Постоянная термопары равна $41\cdot 10^{-6}$ В/°C.

3 Результаты

Удельная проводимость образцов (медь и полупроводник) находится по формуле

$$\sigma = \frac{l}{RS},\tag{6}$$

где l – длина образца, R – его сопротивление, S – поперечное сечение образца.

Размер медного образца: $l=13,4\,\mathrm{m},\,d=0,07\,\mathrm{mm}.$ Размер полупроводника: а $=39,2,\,b=4,1,\,c=4,1\,\mathrm{mm}.$

Образцы нагревались в печи и каждые 10°C измерялись сопротивление и напряжение на образцах. Далее по калибровочному графику напряжение переводилось в температуру, при этом к полученному значению стоило добавить комнатную температуру, которая была равна 24 °C.

По полученным данным были построены графики зависимости $\sigma(T)$ для обоих образцов (рис. 4,5).

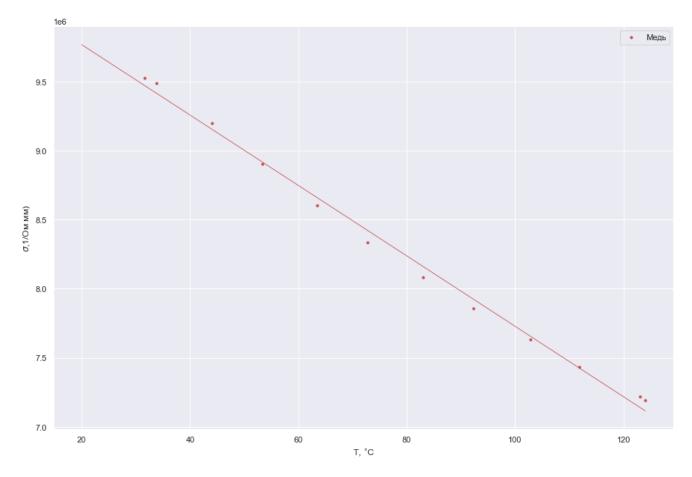


Рисунок 4 – График зависимости удельной проводимости от температуры для образца меди

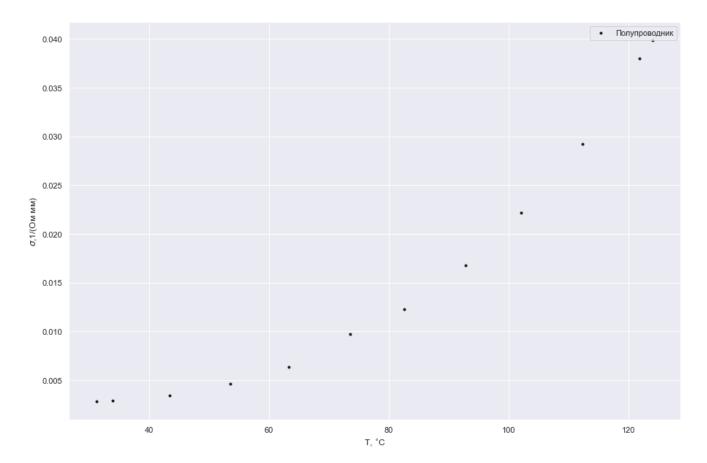


Рисунок 5 – График зависимости удельной проводимости от температуры для образца полупроводника

Наклон графика для медного образца составил

$$k = -25491 \pm 595 \text{ 1/(Om mm °C)}$$

Температурных коэффициент сопротивления определяется по формуле

$$\alpha = \frac{1}{R} \frac{dR}{dT}.$$

Выражая его через коэффициент наклона графика получим

$$\alpha = -\frac{kRS}{l} = 0.0028 \pm 0.0008 \text{ 1/°C}.$$

Сопротивление было взято при комнатной температуре.

Далее был построен график $ln\sigma=f(1/T)$ для образца полупроводника. По наклону его линеной части была определена ширина запрещенной зоны, как было сказано выше коэффициент наклона графика равен $-\Delta/kT$.

$$\Delta = 0.671 \pm 0.009 \text{ sB}.$$

4 Вывод

В ходе лабораторной работы удалось получить зависимость удельной электропроводимости от температуры для образцов меди и полупроводника. По ре-

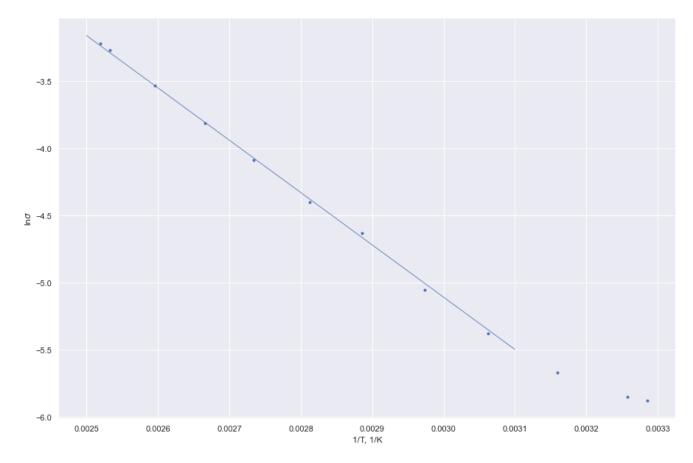


Рисунок 6 – Полулогарифмический график зависимости удельной электропроводности от обратной температуры для образца полупроводника

зультатам эксперимента температурный коэффициент сопротивления меди оказался равным $0,0028\pm0,0008~1/^{\circ}$ С. Табличное значение этой величины $0,0041~1/^{\circ}$ С. Отклонение может быть обусловлено выбором значения сопротивления для подстановки в выражение для α , так как α зависит от сопротивления.

Различие графиков 4 и 5 обсуловлено тем, что медь является металлом, а не полупроводником и для нее, в отличие от полупроводника, нет запрещенной зоны и не характерно распределение (1), которое и задает форму графика 5.

Также в лабораторной работе по графику 6 удалось измерить ширину запрещенной зоны полупроводника, которая составила 0,0671 эВ. Согласно табличным данным, такое значение щели характерно для германия при $300 \mathrm{K} \ (0,67)$ эВ).

Полученные данные согласуются с теорией, однако, так как в эксперименте измерялась температурная завимость удельной электропроводности, то есть температура не была постоянной, то возможны расхождения. А именно, в лабораторном справочнике для запрещенной зоны германия приведены 2 значения запрещенной зоны для разных температур. Начилие ошибки при вычислении температурного коэффициента сопротивления меди было обосновано выше.

5 Литература

1. Лабораторный практикум по общей физике: Квантовая физика: Учеб. пособие для вузов /Игошин Ф.Ф., Самарский Ю.А., Ципенюк Ю.М.